

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2025年11月12日
名称	測長顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	MM-400/L
S/N	3413223
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	落射式/透過式	接眼レンズ	CFI 10x/22 CFI 10x/22 CM
	明視野/暗視野/微分干渉	3軸カウンター	SC#-E1
照明系	落射:HALOGEN 100V/50W	鏡筒	三眼鏡筒
	透過:MM-ED2	ガラスステージ サイズ	210x160mm
総合倍率	50x,100x,200		
		ステージストローク	X:157 mm Y:107 mm
対物レンズ	TU Plan Fluor 5x/0.15A	レボルバー	5個穴手動レボルバー
	TU Plan Fluor 10x/0.30 A		
	TU PlanELWD 20x/0.40 B	その他	落射照明電源:TI-PS100W/A

チェック項目

■ コンディション 評価

総合 問題なし。

外観 問題なし。

光学系 問題なし。

駆動系 Y軸ハンドルに一部ガタがあるが問題なし。

照明 落射、透過問題なし。

手動レボルバー 問題なし。

取扱説明書:無



本体電源投入→三軸カウンタON



測定に使用した標準サンプル

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.5 hr]

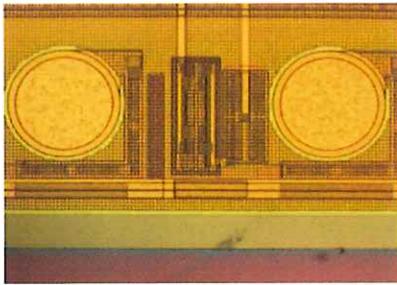
※サンプルは付属しません。
※Y軸ハンドル操作中一部にガタがあるが測定は出来ています。



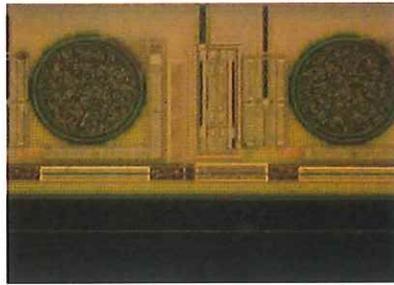
検査担当者[雨宮]

【観察・測定】

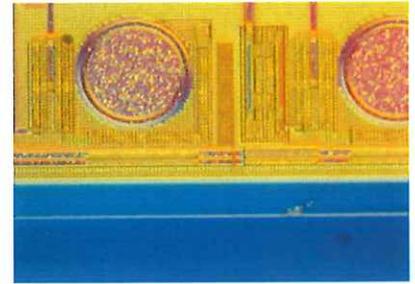
対物レンズ10xを使用して観察(落射観察)



明視野

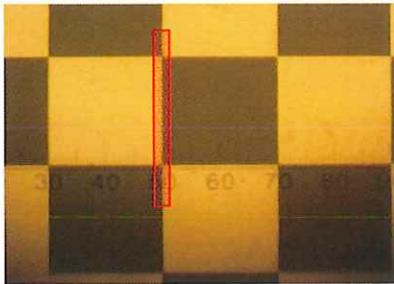


暗視野

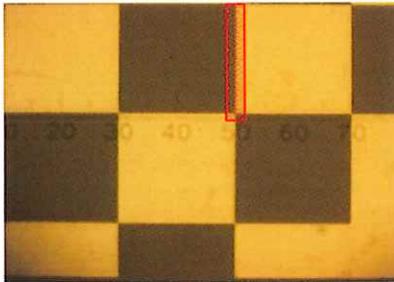


微分干涉

サンプル0.1mmを測定(X軸)



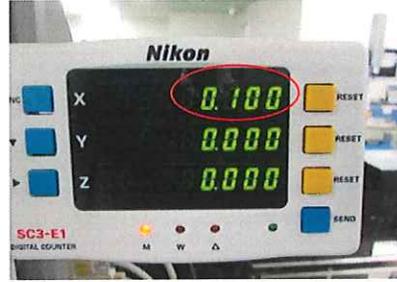
X軸測定開始位置



0.1mmを測定

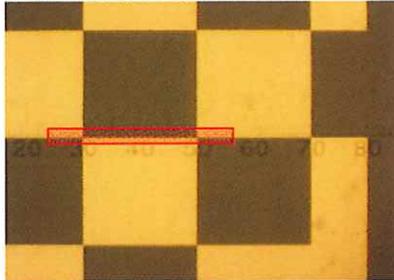


三軸カウンタX軸:0

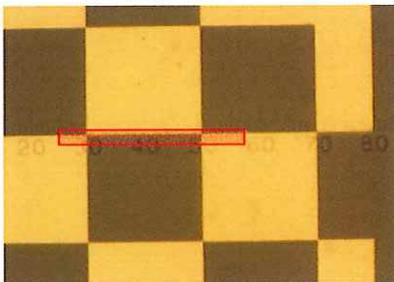


X軸0.100mmを表示

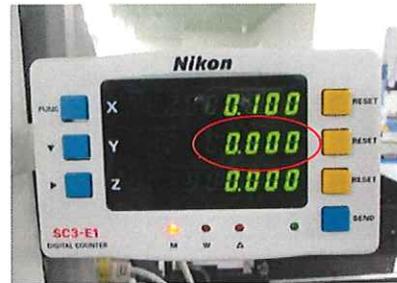
サンプル0.1mmを測定(X軸)



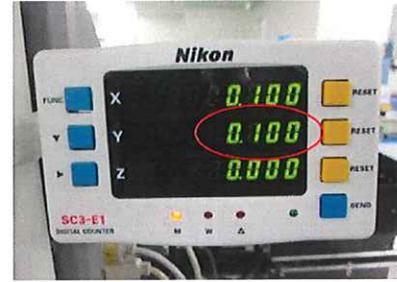
Y軸測定開始位置



0.1mmを測定



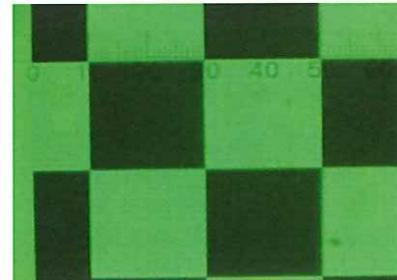
三軸カウンタY軸:0



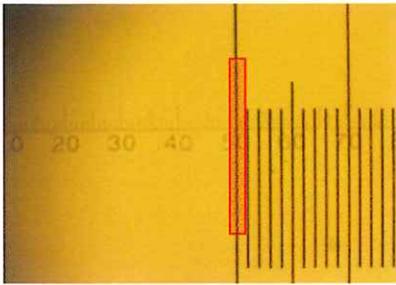
Y軸0.100mmを表示



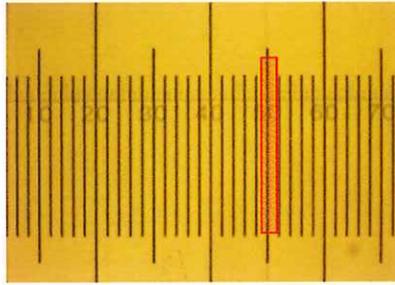
透過照明使用時の視野画像



サンプル0.55mmを測長(X軸)



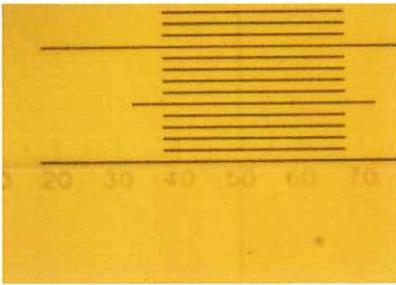
X軸測長開始位置



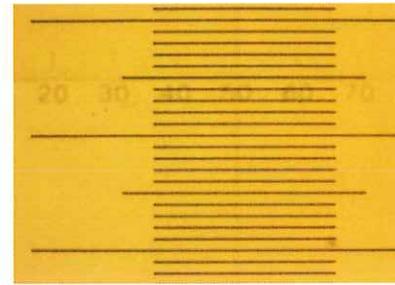
X軸0.55mmを測長



X軸カウンタ表示値



Y軸測長開始位置



Y軸0.55mmを測長



Y軸カウンタ表示値